

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 4 区分
 【発行日】平成 17 年 4 月 21 日 (2005.4.21)

【公開番号】特開 2004-155089 (P2004-155089A)
 【公開日】平成 16 年 6 月 3 日 (2004.6.3)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-021
 【出願番号】特願 2002-323746 (P2002-323746)
 【国際特許分類第 7 版】

B 2 9 C 45/17

B 2 9 C 45/76

【F I】

B 2 9 C 45/17

B 2 9 C 45/76

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 6 月 11 日 (2004.6.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 4】

また、コントローラ 20 は、サンプリング範囲 Z_s における成形データ $D_a \dots$ の標準偏差 E_s に調整係数 K_i を乗じて得る監視幅 C_w を演算する (ステップ S 9)。この場合、監視幅 C_w は、 $C_w = E_s \cdot K_i$ 、即ち、 $E_s^2 = \{ (X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + \dots + X_n^2) / n \} - X_s^2 / n$ の平方根に K_i を乗じて求めることができる。なお、この監視幅 C_w は、サンプリング範囲 Z_s における成形データ $D_a \dots$ の標準偏差 E_s をサンプリング範囲 Z_s における成形データ $D_a \dots$ の平均値 (基準値 X_s) により除した変動係数 U に、調整係数 K_j を乗じて求めることもできる。即ち、監視幅 C_w は、 $C_w = U \cdot K_j = (E_s / X_s) \cdot K_j$ により求めることもできる。いずれの場合も、調整係数 K_i 、 K_j は、各モニタ項目 ($R_a \dots$) 毎に最適な値を設定する。そして、この監視幅 C_w は各モニタ項目 (R_a , R_b , $R_c \dots$) 毎に求める。一方、得られた基準値 X_s と監視幅 C_w は、判別条件として内部メモリ 25 に設定する (ステップ S 10)。この場合、正規の設定としてもよいし、必要により仮設定とし、以後の成形において微調整を行ってもよい。